



X-RAY LAYER THICKNESS METER

镀层厚度检测仪

Ux-720

Ux-720新一代国产专业镀层厚度检测仪，采用高分辨率的Si-PIN（或者SDD硅漂移探测器），测量精度和测量结果业界领先。采用了FlexFP-Multi技术，无论是生产过程中的质量控制，还是来料检验和材料性能检验中的随机抽检和全检，我们都会提供友好的体验和满足检测的需求。

Ux-720微移动平台和高清CCD搭配，旋钮调节设计在壳体外部，观察移动位置简单方便。

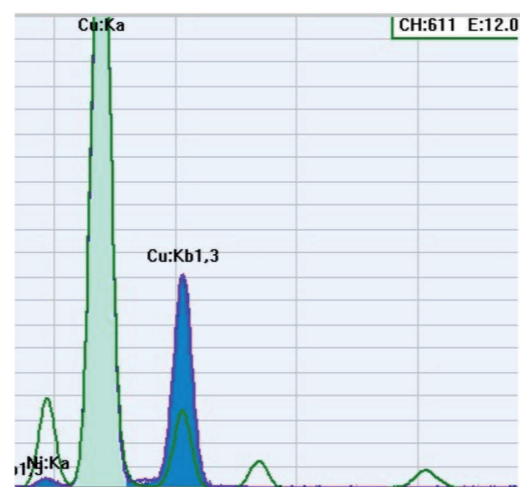
X射线荧光技术测试镀层厚度的应用，提高了大批量生产电镀产品的检验条件，无损、快速和更准确的特点，对在电子和半导体工业中品质的提升有了检验的保障。

Ux-720镀层测厚仪采用了华唯最新专利技术FlexFp-Multi，不在受标准样品的限制，在无镀层标样的情况下直接可以测试样品的镀层厚度，测试结果经得起科学验证。



产品指标

- 测厚技术：X射线荧光测厚技术
- 测试样品种类：金属镀层，合金镀层
- 测量下限：0.003um
- 测量上限：30-50um（以材料元素判定）
- 测量层数：10层
- 测量用时：30-120秒
- 探测器类型：Si-PIN电制冷
- 探测器分辨率：145eV
- 高压范围：0-50KV，50W
- X光管参数：0-50KV，50W，侧窗类；
- 光管靶材：Mo靶；
- 滤光片：专用3种自动切换；
- CCD观察：260万像素
- 微移动范围：XY15mm
- 输入电压：AC220V，50/60Hz
- 测试环境：非真空条件
- 数据通讯：USB2.0模式
- 准直器：Ø1mm，Ø2mm，Ø4mm
- 软件方法：FlexFP-Multi
- 工作区：开放工作区自定义
- 样品腔：330×360×100mm



铜件样品镀镍金和只镀镍样品的谱图对比

样品移动设计为样品腔外部调节，多点测试时移动样品方便快捷，有助于提升效率。设计更科学，软硬件配合，机电联动，辐射安全高于国标GBZ115-2002要求。

软件操作具有操作人员分级管理权限，一般操作员、主管使用不同的用户名和密码登陆，测试的记录报告同时自动添加测试人的登录名称。



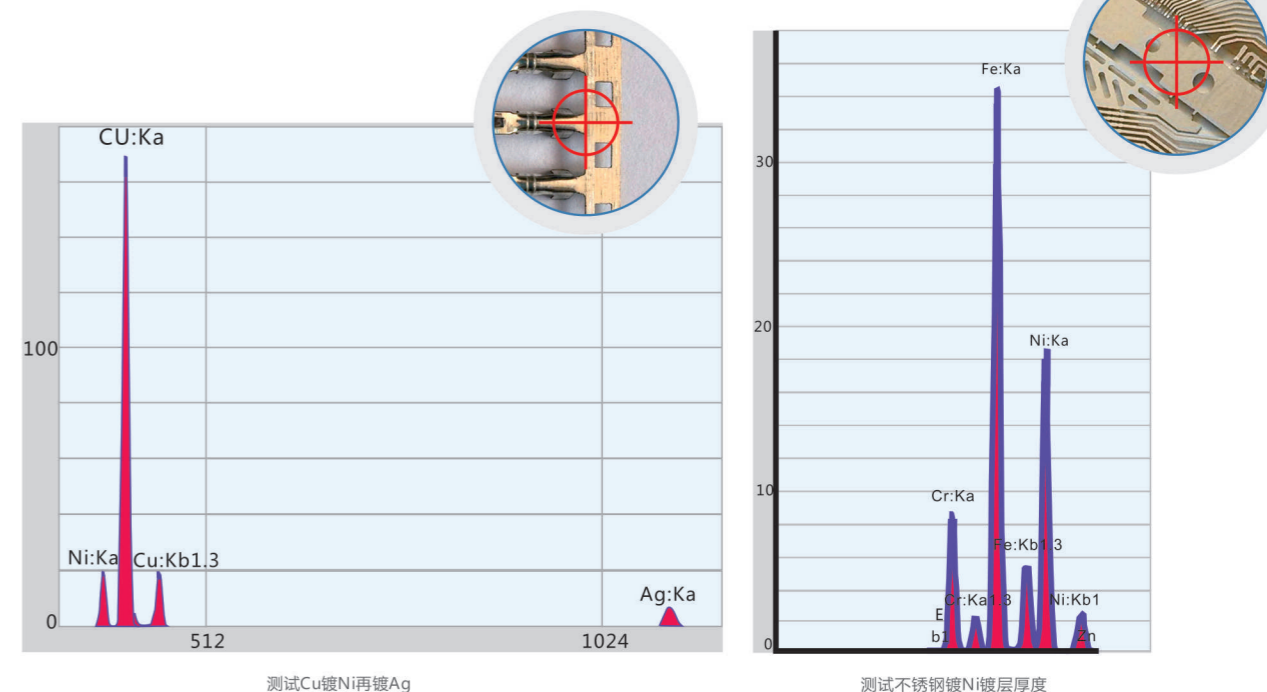
专业辐射检测仪 不同级别人员管理登陆

标准配件

- 样品固定支架1支
- 窗口支撑薄膜：100张
- 保险管：3支

- 计算机主机：品牌+双核
- 显示屏：19吋液晶
- 打印机：喷墨打印机

- 可选配件
- 可升级为SDD探测器



可以实现全自动一键操作功能，准直器自动切换，滤光片自动切换，开盖随意自动停，样品测试照片自动拍照、自动保存，测试报告自动弹出，供应商信息自动筛选和保存.....